

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01251734 A

(43) Date of publication of application: 06 . 10 . 89

(51) Int. Cl

H01L 21/68

(21) Application number: 63079061

(71) Applicant: TERU BARIAN KK

(22) Date of filing: 31 . 03 . 88

(72) Inventor: KIRIYAMA KENJI
KAWAJI TOSHIYUKI
HORIUCHI TAKASHI

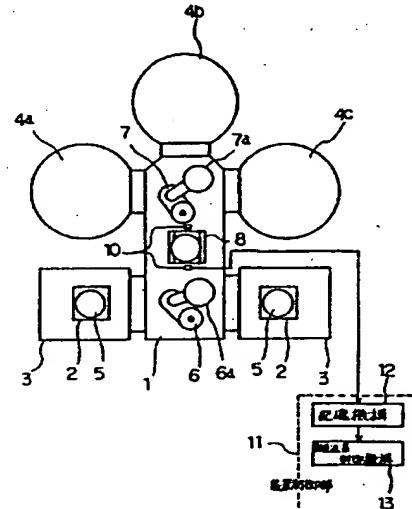
(54) SEMICONDUCTOR MANUFACTURING APPARATUS

difference in the treatment capacity of the individual wafer conveyance mechanisms 6, 7 can be eliminated.

(57) Abstract:

PURPOSE: To enhance the wafer conveyance efficiency and the treatment capacity of an apparatus as a whole by a method wherein a wafer housing mechanism used to temporarily keep a semiconductor wafer is installed between a first wafer conveyance mechanism and a second wafer conveyance mechanism.

CONSTITUTION: Load-lock chambers 3 are arranged and installed individually on both sides by sandwiching a wafer conveyance chamber 1 in the central part of a multi-chamber type CVD apparatus on one side of the conveyance chamber. A conveyance mechanism 6 on the side of the load-lock chambers is installed inside the conveyance chamber 1; a semiconductor wafer 5 is conveyed between wafer carriers 2 inside the individual load-lock chambers 3 and the conveyance chamber 1. A conveyance mechanism 7 on the side of a treatment chamber conveys the semiconductor wafer 1 conveyed to the conveyance chamber 1 to individual treatment chambers, e.g., prescribed treatment chambers 4a, 4b, 4c. A buffer shelf 8 is installed between these conveyance mechanism 6, 7; the semiconductor wafer 5 which has been conveyed by using both conveyance mechanisms 6, 7 is housed temporarily. By this setup, the standby time of a wafer conveyance system due to a



⑫ 公開特許公報 (A) 平1-251734

⑬ Int. Cl. 4
H 01 L 21/68識別記号 庁内整理番号
A-7454-5F

⑭ 公開 平成1年(1989)10月6日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 半導体製造装置

⑯ 特願 昭63-79061

⑰ 出願 昭63(1988)3月31日

⑮ 発明者 桐山 建二 山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1 テル・バリアン
株式会社内

⑮ 発明者 河治 利幸 山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1 テル・バリアン
株式会社内

⑮ 発明者 堀内 孝 山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1 テル・バリアン
株式会社内

⑯ 出願人 テル・バリアン株式会社 山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1

⑰ 代理人 弁理士 須山 佐一

明細書

1. 発明の名称

半導体製造装置

2. 特許請求の範囲

ウエハキャリアに収容された半導体ウエハを取出す第1のウエハ搬送機構と、前記第1のウエハ搬送機構により搬送された半導体ウエハを処理室内に搬送する第2のウエハ搬送機構とを備えた半導体製造装置において、

前記第1のウエハ搬送機構と、第2のウエハ搬送機構間に、これら両ウエハ搬送機構により搬送された半導体ウエハを一時保管するための複数枚のウエハ収容機構を設けたことを特徴とする半導体製造装置。

3. 発明の詳細な説明

【発明の目的】

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体製造装置に関する。

(従来の技術)

近年の半導体製造工程で使用する半導体の製

造装置例えばCVD装置等では、多品種・少量生産化に対応するために、各半導体ウエハ毎に生産管理が可能な枚葉処理方式の製造装置が普及しており、このような枚葉処理方式の半導体製造装置では、予備真空室となるロードロック室にウエハキャリアを収容し、このウエハキャリアから所定の半導体ウエハを搬送装置により取出して、所定の処理室へと搬送するような構成となっている。

このような半導体製造装置の搬送装置は、ロードロック室から半導体ウエハを取出して装置内に搬送するロードロック室側搬送系と、このロードロック室側搬送系により搬送された半導体ウエハを移載して所定の処理室までこれを搬送する処理室側搬送系とから構成されており、処理室側搬送系により所望の処理室へと半導体ウエハを搬送して一連の処理が可能となっている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上述した従来の半導体製造装置では、ロードロック室側の搬送系と処理室側の搬送系に処理能力差がある場合には、全体の搬送

処理能力が処理能力の低い搬送系の処理能力となり、さらに処理能力の低い搬送系に待ち時間を生じた時等、装置全体の処理能力を低下させる原因となっていた。

例えば、処理室側搬送系が半導体ウエハを各処理室に搬送している間は、ロードロック室側の搬送系は、次処理の半導体ウエハを保持したまま処理室側搬送系への移載場所で待機していなければならず、逆に処理室側搬送系の処理が早い場合には、ロードロック室側搬送系が次処理の半導体ウエハを移載場所まで搬送するまで待機しなければならなくなる。

本発明は、上述した従来の問題点を解決するためになされたもので、処理室側搬送系とロードロック室側搬送系間に半導体ウエハの一時収容機構を設けることで、各搬送系の待機時間がなくなり、ウエハ搬送効率を向上させ、装置全体の処理能力が向上する半導体の製造装置に関する。

【発明の構成】

(課題を解決するための手段)

中央部に配置されたウエハ搬送室1の一方には、これを挟んで両側に夫々ウエハキャリア2を収容するロードロック室3が配設されており、また、ウエハ搬送室1の他方には、ウエハ搬送室1を中心としてほぼ90°の角度間隔をおいて3つのチャンバ4a、4b、4cが同心円上に配設されている。

ウエハ搬送室1内には、各ロードロック室3内のウエハキャリア2とウエハ搬送室1間で、半導体ウエハ5の搬送を行うためのロードロック室側搬送機構6と、このロードロック室側搬送機構6により搬送室1に搬送された半導体ウエハ5を各処理室4a、4b、4cの所定の処理室へと搬送するための処理室側搬送機構7、そして、これら両搬送機構6、7の間に設けられ、両搬送機構6、7により搬送された半導体ウエハ5を一時収容するためのバッファ棚8が設けられている。

このようなCVD装置における半導体ウエハの処理は、まず、ロードロック室側搬送機構6のウエハ保持部例えば搬送アーム6a等により、ウエ

本発明の半導体製造装置は、ウエハキャリアに収容された半導体ウエハを取出す第1のウエハ搬送機構と、前記第1のウエハ搬送機構により搬送された半導体ウエハを処理室内に搬送する第2のウエハ搬送機構とを備えた半導体製造装置において、前記第1のウエハ搬送機構と、第2のウエハ搬送機構間に、これら両ウエハ搬送機構により搬送された半導体ウエハを複数枚一時保管するためのウエハ収容機構を設けたことを特徴とするものである。

(作用)

第1のウエハ搬送機構と、第2のウエハ搬送機構間に、半導体ウエハを一時保管するためのウエハ収容機構を設けることで、両ウエハ搬送機構の待機時間がなくなり、ウエハ搬送効率が向上し、装置全体の処理能力を向上させることができる。

(実施例)

以下、本発明をマルチチャンバ型CVD装置に適用した一実施例について図を参照して説明する。

ハキャリア2から所定の半導体ウエハ5を取出して、これを搬送室1内のバッファ棚8へ移載する。そして、処理室側搬送機構7のウエハ保持部例えば搬送アーム7aにより、このバッファ棚8から所定の半導体ウエハを取出し、所定のチャンバへと搬送し、一連の処理を行う。処理終了後の半導体ウエハは、上記動作と逆の動作で搬送して所定のウエハキャリアへ収容する。

ところで、バッファ棚8は、多数の半導体ウエハを収容できるように、例えば第2図に示すように、多段式の棚とし、各棚(以下、スロット)8aに夫々半導体ウエハ5を収容するように構成されている。

このバッファ棚8は、昇降台9上に搭載されており、この昇降台9を駆動させて所定のスロット8aをウエハ搬送機構6、7の搬送アーム6a、7aと同レベルの高さにし、半導体ウエハ5の移載を行う。

また、バッファ棚8の昇降路に沿って、例えばフォトセンサ等のスロット位置検出機構10がバ

バッファ棚8の昇降路を水平に横切るように対向して配設されており、このスロット位置検出機構10により何段目のスロットが半導体ウエハへの移載を行ったかを知ることができ、該位置情報をこのときの半導体ウエハの品種情報をとともに装置制御部11の記憶機構12に記憶させておくことで、バッファ棚8の各スロットに収容された半導体ウエハの収容管理を行うことができる。そして、この記憶情報に基づいて搬送系制御機構13が各ウエハ搬送系6、7の動作を制御することで、バッファ棚8と各ウエハ搬送系6、7間のウエハ移載動作を予め定められたプログラムに基づいて行うことができる。

このように、各ウエハ搬送機構6、7間にバッファ棚8を設け、このバッファ棚8に半導体ウエハを一時収容する構成とすることで、各ウエハ搬送機構6、7の処理能力の差により生じるウエハ搬送系の待機時間がなくなり、装置全体の処理能力が向上する。

ところで上述実施例では、バッファ棚8の設置

6、7……ウエハ搬送機構、8……バッファ棚、
9……昇降台、10……スロット位置検出機構、
11……装置制御部、12……記憶機構。

出願人 テル・バリアン株式会社
代理人 弁理士 須山 佐一

数を1つとしたが、特に設置数に限定されるものではなく、例えば、未処理の半導体ウエハを収容するバッファ棚と処理済の半導体ウエハを収容するバッファ棚とを別々に設ければ、各ウエハ搬送系の待機時間をさらに短縮することができる。

また、バッファ棚近傍にウエハ冷却媒体を配設すれば、処理プロセス中でウエハの冷却を行うこともできる。

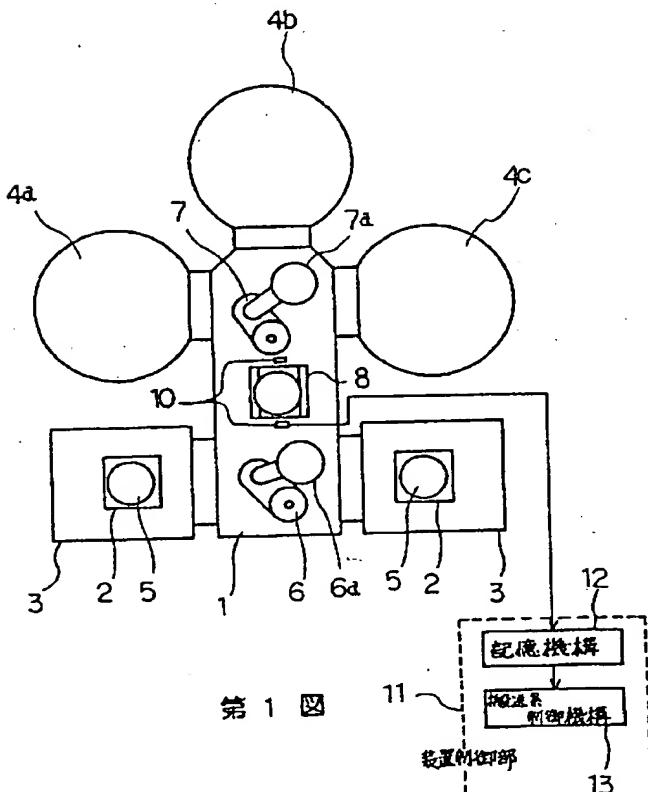
【発明の効果】

以上説明したように、本発明の半導体製造装置によれば、半導体ウエハの搬送系の搬送効率が向上し、装置全体の処理能力の向上が図れる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明をマルチチャンバ型CVD装置に適用した実施例の装置構成を示す図、第2図(a)は第1図のバッファ棚の構成を示す平面図であり、第2図(b)は第2図(a)の側面図である。

1……搬送室、3……ロードロッカ室、4a、4b、4c……チャンバ、5……半導体ウエハ、



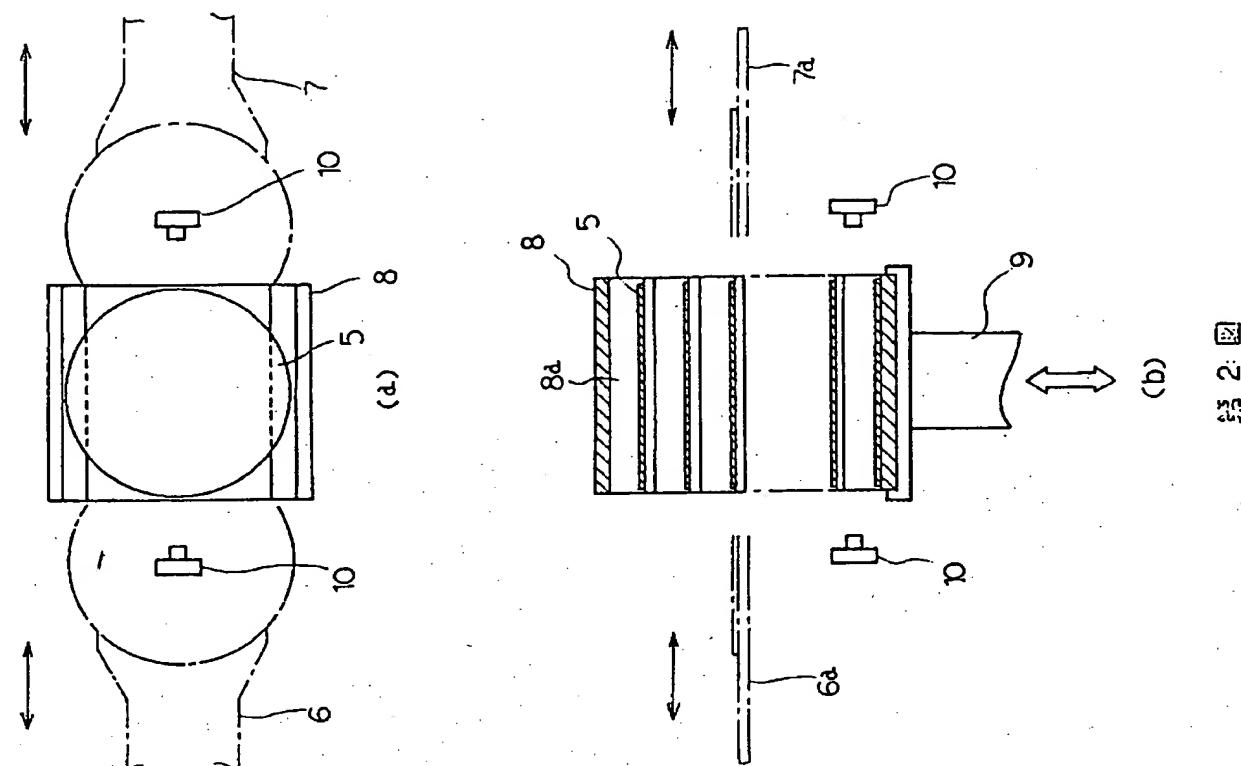


図2